

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 28.06.2022 10:59:44
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad56

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет
Кафедра

Естественнонаучный
Общей и теоретической физики

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

дисциплина ***Б1.В.ДВ.06.01 Дифракционные методы исследования и анализа***

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Направление

03.03.02
код

Физика
наименование направления

Программа

Медицинская физика

Форма обучения

Очная

Для поступивших на обучение в
2021 г.

Стерлитамак 2022

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-3. Техническое обслуживание биотехнических и медицинских аппаратов и систем	ПК-3.1. Вводит в эксплуатацию биотехнические и медицинские аппараты и системы	Обучающийся должен: иметь представление об эксплуатации биотехнических и медицинских аппаратов, дифрактометров, нейтронографов, спектрометров.
	ПК-3.2. Контролирует техническое состояние биотехнических и медицинских аппаратов и систем	Обучающийся должен: контролировать техническое состояние биотехнических и медицинских рентгеновских аппаратов, дифрактометров, спектрометров, проводить диагностику неисправностей.
	ПК-3.3. Технически обслуживает и ремонтирует биотехнические и медицинские аппараты и системы	Обучающийся должен: иметь навыки работы на медицинских рентгеновских аппаратах, рентгеновских дифрактометрах, спектрометрах. Анализировать результаты исследований с привлечение цифровых технологий и программ. Проводить текущий ремонт и следить за соблюдением техники безопасности.

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Физика», «Математика», а также в ходе изучения таких дисциплин, как общая физика, физика конденсированного состояния, математический анализ, аналитическая геометрия, линейная алгебра, векторный и тензорный анализ, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика.

Освоение данного модуля является необходимой основой для формирования компетенций при прохождении производственной и преддипломной практики, при оформлении выпускных квалификационных работ.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	24
практических (семинарских)	24
лабораторных	30
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	34,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	30

Формы контроля	Семестры
экзамен	8

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			
		Контактная работа с преподавателем			СР
		Лек	Пр/Сем	Лаб	
1	Кристаллическая структура.	6	6	9	9
3.5	Спектроскопические методы исследования материалов	2	2	3	3
3.4	Электроннография	2	2	3	3
3.3	Устройство нейтронографов	2	4	3	3
3.2	Устройство дифрактометров	4	4	3	3
3.1	Дифракционные методы исследования структуры кристаллов	4	2	3	3
3	Методы исследования внутреннего строения кристаллов.	14	14	15	15
2.1	Способы выбора элементарной ячейки	2	2	3	3
2	Элементарные ячейки. Симметрия кристаллов.	4	4	6	6
1.3	Кристаллографические проекции.	2	2	3	3
1.2	Обратная решетка.	2	2	3	3
1.1	Пространственные решетки.	2	2	3	3

2.2	Классификация типов решеток	2	2	3	3
	Итого	24	24	30	30

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Кристаллическая структура.	
3.5	Спектроскопические методы исследования материалов	Спектроскопические методы: оптическая спектроскопия, инфракрасная и рамановская спектроскопия. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Оже - электронная спектроскопия. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс. Ядерный гамма-резонанс- эффект Мессбауера. Применение ЯМР и ЯГР для исследования твердых тел.
3.4	Электроннография	Устройство электронографов. Методы получения электронных пучков. Методика исследования пленок.
3.3	Устройство нейтронографов	Получение нейтронных пучков, пригодных для исследования. Устройства установок для исследования материалов с помощью нейтронных пучков.
3.2	Устройство дифрактометров	Получение рентгеновского излучения. Устройство рентгеновских трубок. История открытия рентгеновских лучей. Работа Ж.Кюри, Рентгена, Лауэ и др. Дифрактометры. Принципиальная схема устройства дифрактометра. Способы регистрации рентгеновского излучения.
3.1	Дифракционные методы исследования структуры кристаллов	Методы исследования внутреннего строения кристаллов. Дифракционные методы: рентгеновские, электронография, нейтронография. ПСпецпрактикум. Приготовление образцов. Съёмка на дифрактометре ДРОН-4.07, индицирование рентгенограмм. Определение типа сингонии. Расчет параметров элементарной ячейки. Определение объема элементарной ячейки. Определение рентгеновской плотности.
3	Методы исследования внутреннего строения кристаллов.	
2.1	Способы выбора элементарной ячейки	Элементарные ячейки. Способы выбора элементарной ячейки. Понятие примитивной ячейки. Ячейки с базисом. Преобразования элементарных трансляций при изменении ячейки. Обозначение ячейки с базисом. Преобразования обратных векторов. Преобразования индексов узла. Преобразования индексов плоскости. Простые элементы симметрии. Ось симметрии. Плоскость симметрии. Центр симметрии. Основные теоремы о поворотных осях. Трансляция. Инверсионные оси. Сложение элементов симметрии. Возможности сочетания осей. Одиннадцать точечных групп с поворотными осями. Класс симметрии. Использование симметрии для получения 32 классов симметрии.

2	Элементарные ячейки. Симметрия кристаллов.	
1.3	Кристаллографические проекции.	Кристаллографические проекции. Понятие кристаллического и полярного комплекса. Гномоническая проекция. Стереографическая проекция. Гномостереографическая проекция. Сетка Вульфа и приемы работы с ней.
1.2	Обратная решетка.	Обратное пространство. Обратная решетка. Определение элементарной трансляции обратной решетки. Радиус-вектор в обратной решетке. Применение обратной решетки для интерпретации уравнения Вульфа-Брэгга. Связь между функцией, определенной в пространстве объекта и функцией, определенной в обратном пространстве. Применение понятия обратной решетки к решению некоторых кристаллографических задач.
1.1	Пространственные решетки.	Пространственные решетки. Кристаллическое состояние. Понятие кристаллической решетки. Аналитическое описание пространственной решетки. Период повторяемости. Элементарная ячейка. Индексы узла. Узловые прямые. Узловая плоскость. Символ семейства узловых плоскостей. Комплекс плоскостей. Четвертый индекс плоскости в гексагональной системе.
2.2	Классификация типов решеток	Понятие кристаллографической простой формы. Общие и частные формы. Особенности кубических классов симметрии. Пространственная решетка. Ячейки Браве. Типы решеток Браве. Пространственные (федоровские) группы симметрии. Обозначения групп симметрии: по Шенфлису, международный, по Шубникову и т.д.

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Кристаллическая структура.	
3.5	Спектроскопические методы исследования материалов	Изучение устройства спектрометров и их использования для анализа химического состава материалов.
3.4	Электроннография	Изучение методов исследования пленок.
3.3	Устройство нейтронографов	Методы исследования динамики решетки кристаллов
3.2	Устройство дифрактометров	Расчет энергетических характеристик рентгеновских трубок.
3.1	Дифракционные методы исследования структуры кристаллов	
3	Методы исследования внутреннего строения кристаллов.	
2.1	Способы выбора элементарной ячейки	Решение задач по теме «Расчет параметров элементарной ячейки. Определение рентгеновской плотности»

2	Элементарные ячейки. Симметрия кристаллов.	
1.3	Кристаллографические проекции.	Решение задач по темам «Кристаллографические проекции»
1.2	Обратная решетка.	Решение задач по теме «Симметрия кристаллов»
1.1	Пространственные решетки.	Решение задач по теме «Индексы Миллера»
2.2	Классификация типов решеток	Определение рентгеновской плотности»

Курс лабораторных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
1	Кристаллическая структура.	
3.5	Спектроскопические методы исследования материалов	Лабораторная работа № 9. Определение содержания хлорофилла методом спектрофотометрии. Лабораторная работа № 10. Определение размеров кристаллитов в веществах.
3.4	Электроннография	
3.3	Устройство нейтронографов	
3.2	Устройство дифрактометров	Лабораторная работа № 2. Рентгеновский дифрактометр. Лабораторная работа № 5. Приготовление поликристаллических образцов для рентгеноструктурного анализа
3.1	Дифракционные методы исследования структуры кристаллов	Лабораторная работа № 1. Изучение рентгеновских трубок и аппаратов Лабораторная работа № 7. Качественный фазовый рентгеноструктурный анализ Лабораторная работа № 8. Количественный фазовый рентгеноструктурный анализ
3	Методы исследования внутреннего строения кристаллов.	
2.1	Способы выбора элементарной ячейки	Лабораторная работа № 5. Прецизионные измерения периодов кристаллической решетки
2	Элементарные ячейки. Симметрия кристаллов.	
1.3	Кристаллографические проекции.	
1.2	Обратная решетка.	Лабораторная работа № 4. Индексирование рентгенограмм. Определение типа решетки и размеров элементарной ячейки
1.1	Пространственные решетки.	Лабораторная работа № 3. Установление вещества по данным о межплоскостных расстояниях
2.2	Классификация типов решеток	Лабораторная работа № 6. Определение типа

		твёрдого раствора на основе вещества с кубической решёткой
--	--	---